

杨玉华,曹杰. 1991. 高铝岩矿样品的X射线荧光光谱分析. 岩石学报, 7(1): 83-85

高铝岩矿样品的X射线荧光光谱分析

[杨玉华](#) [曹杰](#)

中国科学院地质研究所, 中国科学院地质研究所 北京 100029, 北京 100029

基金项目:

摘要:

1.概述高铝岩矿样品的成分分析在地质科研、找矿勘探、建筑陶瓷、耐火材料和磨料磨具等工业部门具有重要的意义。目前多沿用传统的化学方法,速度慢,成本高。X射线荧光光谱分析快速、简便、低成本,近十年发展较快。而对高铝岩矿样品的分析却少见报道。刁桂年等(1983),杨玉华等(1987)文章中虽也涉及到了铝土矿的分析,但还不能满足像矾土这类高铝岩矿样品分析的需要。本法可分析Al₂O₃含量高达85%的高铝岩矿样品和铝含量较低

关键词: [高铝岩矿](#) [样品](#) [X射线](#) [光谱分析](#)

[查看全文](#) [查看/发表评论](#) [下载PDF阅读器](#)

您是第915702位访问者

主办单位: 中国矿物岩石地球化学学会 中国科学院地质与地球物理研究所 单位地址: 北京9825信箱/北京朝阳区北土城西路19号 中国科学院地质与地球物理研究所

[本系统由北京勤云科技发展有限公司设计](#)

